СЕКЦИЯ 3. СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модульный принцип построения вакуумных установок для микроэлектронных технологий

В.В. Одиноков, В.В. Панин Москва, Зеленоград, ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения», Панфиловский проспект, д. 10 e-mail: vodinokov@niitm.ru

Представлен модульный принцип создания вакуумно-плазменного оборудования для микроэлектронных технологий с использованием различных вариантов загрузки-выгрузки пластин в рабочий модуль (реактор): установки с поштучной ручной загрузкой-выгрузкой пластин, с поштучной загрузкой-выгрузкой пластин из шлюзовой камеры манипулятором, с поштучной загрузкой-выгрузкой пластин манипулятором из кассеты-в-кассету в шлюзовой камере, а также оборудование кластерного типа. Рабочие модули установок обеспечивают высокие требования к процессам плазмохимического травления.

The modular principle of vacuum systems creating for microelectronic technologies. V.V.Odinokov, V.V.Panin. The modular principle of creating vacuum-plasma equipment for microelectronic technologies using various options for loading and unloading substrates into a working module (reactor) is presented: systems with single manual loading and unloading substrates, with single loading and unloading substrates from a loadlock by a manipulator, with single loading and unloading substrates with a manipulator from a cassette-to-cassette in a loadlock, as well as cluster type equipment. Working modules of systems provide high requirements to the processes of plasma etching.

Ввеление

В производстве интегральных схем (ИС) с использованием вакуумных технологий на выход годных ИС существенное влияние оказывает воспроизводимость остаточной газовой среды в вакуумной камере (реакторе), а также исключение попадания на поверхность рабочих пластин инородных частиц (пылинок) при напуске и откачке рабочего объёма реактора. Особенно эти факторы негативно оказывают влияние на выход годных ИС с увеличением уровня их интеграции.

На производительность вакуумных установок в большей степени влияет потеря рабочего времени на откачку вакуумного объёма до предельного давления и напуск воздуха для его разгерметизации.

Поэтому при проектировании вакуумных установок для современных микроэлектронных технологий необходимо уделять особое внимание перечисленным выволам.

Существуют различные варианты загрузки-выгрузки кремниевых пластин в реактор вакуумного технологического оборудования, представленные на рис. 1:

- поштучная ручная загрузка-выгрузка пластин или группы пластин в рабочий модуль реактор (рис. 1а);
- поштучная загрузка-выгрузка пластин манипулятором в реактор из шлюзовой камеры (рис. 1б);
- поштучная загрузка-выгрузка пластин манипулятором в реактор из кассеты-в-кассету из шлюзовой камеры (рис. 1в);
- поштучная загрузка-выгрузка пластин манипуляторами в несколько рабочих модулей реакторов из нескольких шлюзовых камер из кассеты-в-кассету и с использованием

СМИФ (стандартный механический интерфейс) контейнеров - «кластерная система» вакуумного оборудования (рис. 1г).

Рис. 1. Варианты модульной компоновки вакуумно-плазменных установок. 1 - рабочий модуль, 2 - столик, 3 - пластина; 4 - загрузочный модуль (шлюзовая камера), 5 - манипулятор, 6 - щелевой затвор, 7-модуль транспортирования, 8 - кассета с пластинами.

Таблица 1. Варианты модульной компоновки вакуумных установок с точки зрения производительности и выхода годной продукции.

Основные характеристики

В таблице 1 представлены варианты модульного проектирования вакуумных установок с учетом повышения их производительности и выхода годной продукции.

Поштучная ручная загрузка-выгрузка пластин или группы пластин в рабочий модуль - реактор применяется при обработке небольших партий пластин, а также при невысоких требованиях к остаточной вакуумной среде (рис. 2). Это оборудование имеет небольшую производительность, так как достаточно много времени тратиться на откачку до высокого вакуума рабочей камеры и на разгерметизацию её перед выгрузкой пластин. При вскрытии рабочего модуля (реактора) на атмосферу происходит смена состава газовой среды, что ведет к невоспроизводимости рабочей газовой среды и создает дополнительное образование частиц пыли в камере, что существенно влияет на привносимую дефектность и выход годных ИС.

Рис. 2. Фотография модуля установки с поштучной ручной загрузкой-выгрузкой пластин.

Для технологии микроэлектронных производств на пластинах диаметром от 100 до 200 мм необходимо снизить привносимую дефектность и тем самым повысить выход годных изделий. Для этого необходимо применять шлюзовую камеру с расположенным в ней манипулятором, который транспортирует необработанную пластину в рабочий модуль реактор и возвращает обратно после обработки. За счет небольшого времени на откачку и разгерметизацию небольшого объёма шлюзовой камеры увеличивается производительность установки в целом.

В качестве примера по такой схеме была создан установка травления мелкой щелевой изоляции в кремнии, оборудованной поштучной загрузкой-выгрузкой пластин манипулятором в рабочий модуль (реактор) из шлюзовой камеры (рис. 3). При этом рабочий модуль (рис. 2) использовался для стыковки с модулем загрузки-выгрузки из шлюзовой камеры.

Загрузка и выгрузка пластин 13 диаметром от 100 до 200 мм происходит с помощью манипулятора 12 из шлюзовой камеры 1. Предельное давление достигается с помощью средств вакуумной откачки через откачные патрубки 7, 10 и 11. Через затвор 2 манипулятор транспортирует пластину на рабочий стол в рабочем модуле - реакторе 9. Охлаждаемый столик имеет канал подачи гелия 6 под пластину и через согласующее устройство подключен к генератору с частотой 13,56 МГц. Индуктор 4 через согласующее устройство подключен к генератору с частотой 13.56 МГц. Процессные газы подаются в реактор через газовый «душ» 3 и 5. Передача мощности от индуктора в реактор происходит через толстый кварцевый диск. Продукты реакции удаляются средствами вакуумной откачки через откачные патрубки 7 и 10. После завершения технологического процесса манипулятор перемещает обработанную пластину в шлюзовую камеру для ее выгрузки и загрузки новой необработанной пластины.

Рис. 3. Схема (а) и фотография общего вида (б) установки травления мелкой щелевой изоляции в кремнии.

На установке реализован процесс травления гладких щелей шириной 1 мкм на глубину 2 мкм в кремниевой пластине (рис. 4). Мощность верхнего генератора не превышала 1000 Вт, а нижнего - 160 Вт. Процесс проходил при давлении в реакторе от 2 до 5 Па. Продолжительность процесса не превысила 180 с.

Рис. 4. РЭМ-изображение результатов формирования щелей в кремниевой пластине.

Для увеличения производительности такого вида оборудования использовалась компоновка по схеме рис. 1в. Применялся загрузочный модуль со шлюзовой камерой с расположенной в ней кассетой из 25 пластин. Манипулятор поштучно транспортирует необработанные пластины из кассеты в рабочий модуль (реактор) и возвращает обратно после обработки (рис. 5).

Загрузка и выгрузка пластин 3 диаметром от 100 до 200 мм происходит с помощью манипулятора 11 из шлюзовой камеры 1 с кассетой 13. Предельное давление достигается с помощью средств вакуумной откачки через откачные патрубки 8, 10 и 12. Через затвор 2 манипулятор транспортирует пластину на рабочий стол в реакторе. Охлаждаемый столик имеет канал подачи гелия 7 под пластину и через согласующее устройство подключен к ВЧгенератору с частотой 13,56 МГц. Источник плазмы 4 применяется для генерации радикалов и ионов, получаемых при прохождении газа 5 через индуктор 6, подключенный через согласующее устройство к генератору с частотой 13,56 МГц. Продукты реакции удаляются средствами вакуумной откачки через откачные патрубки 8 и 10. После завершения технологического процесса манипулятор перемещает обработанную пластину в шлюзовую камеру для ее выгрузки и загрузки новой необработанной пластины.

Рис. 5. Схема (а) и фотография общего вида (б) установки глубокого анизатропного травления кремния.

На установке реализован процесс анизотропного травления отверстий с разным аспектным отношением в кремниевой пластине через фоторезистивную маску толщиной 2.2 мкм (рис. 6) Мощность генератора источника плазмы не более 1200 Вт, а мощность генератора рабочего стола не более 90 Вт. Процесс проходил при давлении в реакторе от 2 до 5 Па. Время подачи травящего реагента SF₆ не превысило 3 с, а осаждающегося реагента C₄F₈ – 6 с. Получены значения неоднородности процесса травления в пределах 2 - 3 % глубоких отверстий и щелей с большим аспектным соотношением (более 15) и низкой шероховатостью стенок, при скорости травления кремния до 5 мкм/мин.

Рис. 6. РЭМ-изображение результатов травления отверстий в кремниевой пластине.

Оборудование данного типа и компоновки соответствует производству ИС с уровнем технологии ~ 180 нм. Установки удобно встраиваются в производство с «чистыми» комнатами (рис. 7).

Рис. 7. Фотография установок, размещенных в « чистой» комнате.

Развитие микроэлектронных технологий с увеличением степени интеграции с топологическими нормами $80 - 40$ нм, а в дальнейшем до $20 - 10$ нм на пластинах диаметром 200 - 300 мм предъявляет к вакуумно-плазменному оборудованию ещё более высокие требования. Во-первых, само оборудование должно размещаться в «чистом» помещении и перенос кассет между установками должен осуществляться в почти герметичных переносных контейнерах (СМИФ). Транспортирование пластин из кассеты-в-кассету должно происходить в вакууме или в «обезпыленной» зоне (боксе).

Перемещение пластин между шлюзовыми системами и рабочими модулями должно обеспечиваться одним или несколькими манипуляторами, которые располагаются в модуле транспортирования. Манипуляторы при своем движении не должны выделять частицы, которые могут попасть на поверхность пластин. В транспортном модуле поддерживается более низкое давление, чем в рабочих модулях и этим обеспечивается вакуумная «блокировка» рабочих модулей друг от друга. Этот вид оборудования называется «кластерным».

кластерными Управление установками обеспечивается двухуровневой микропроцессорной системой управления (МСУ). Верхний уровень обеспечивает работу шлюзовых систем, загрузку-выгрузку пластин между кассетами и перемещение пластин в модуле транспортирования и передачу их в рабочие модули. Каждый рабочий модуль управляется индивидуальной МСУ.

На рис. 1г и рис. 8 изображены схема и фото разработанной кластерной установки четырьмя рабочими модулями.

Рис. 8. Фотография общего вида кластерной транспортной системы.

Вывод

Таким образом, в зависимости от требований технологических процессов и уровня топологических норм, могут быть различные варианты загрузки-выгрузки пластин в рабочий модуль - реактор специального технологического оборудования для микроэлектронных технологий, а именно: поштучная ручная загрузка-выгрузка, поштучная загрузка-выгрузка из шлюзовой камеры манипулятором, поштучная загрузка-выгрузка манипулятором из кассетыв-кассету в шлюзовой камере, а также оборудование кластерного типа. При этом используются различные модули, что является прогрессивным решением при создании другого технологического оборудования.

Достигнуты хорошие технологические результаты работы на установках травления мелкой щелевой изоляции в кремнии и глубокого анизатропного травления кремния. Микропроцессорная система управления установками обеспечивает контроль параметров процесса и поддерживает их стабильность согласно установленным значениям. Это обеспечивает хорошую воспроизводимость технологических процессов.

Созданы несколько рабочих модулей: глубокого анизотропного травления кремния, травления мелкой щелевой изоляции в кремнии, очистки пластин от органических загрязнений в СВЧ разряде и атомно-слоевого осаждения. Разрабатываются модули нанесения пленок в магнетронном разряде (PVD), быстрого термического отжига (RTA), осаждения пленок из газовой фазы (CVD) и атомно-слоевого травления (ALE). Модули взаимозаменяемы на портах модуля транспортирования установки.

Размещение оборудования данного типа в чистых производственных помещениях позволит повысить производительность и значительно снизить привносимую дефектность на пластины, что приведет к значительному повышению выхода годных ИС с более высокими требованиями к технологической топологии.

Литература

- 1. Одиноков В.В., Панфилов Ю.В. Выбор типа вакуумного нанотехнологического оборудования по критерию заданной производительности // Наноинженерия. 2011. №11. $C.7 - 18.$
- 2. Патент РФ 2679863 от 13.02.2019. Манипулятор для перемещения полупроводниковых пластин.
- 3. Одиноков В.В., Долгополов В.М., Иракин П.А., Панин В.В. Технологическое оборудование для глубокого травления кремния, мелкощелевой изоляции, удаления фоторезиста и атомно-слоевого осаждения. Электроника и микроэлектроника СВЧ 2018. No 1 (1), C, 24-29.
- 4. Новые вакуумно-плазменные процессы и оборудование для микроэлектроники. Одиноков В.В. Вакуумная техника и технология. 2018. Т. 28. № 1. С. 2.1-2.8.